

プリント基板上有機物系異物の分析

適切なサンプリングと顕微測定で異物周辺情報の影響を軽減

測定法 : FT-IR

製品分野 : 電子部品

分析目的 : 組成評価・同定

概要

サンプリングを併用した顕微FT-IR分析が有効な異物の評価事例を紹介します。
下地の影響がほとんど無い電極上異物はフラックスと同定されましたが、プリント基板上異物からは異物由来の情報が取得できませんでした(図1)。無機結晶上にサンプリングを行うことで異物の情報が得られ、異物はフラックスと同定されました(図2)。

データ

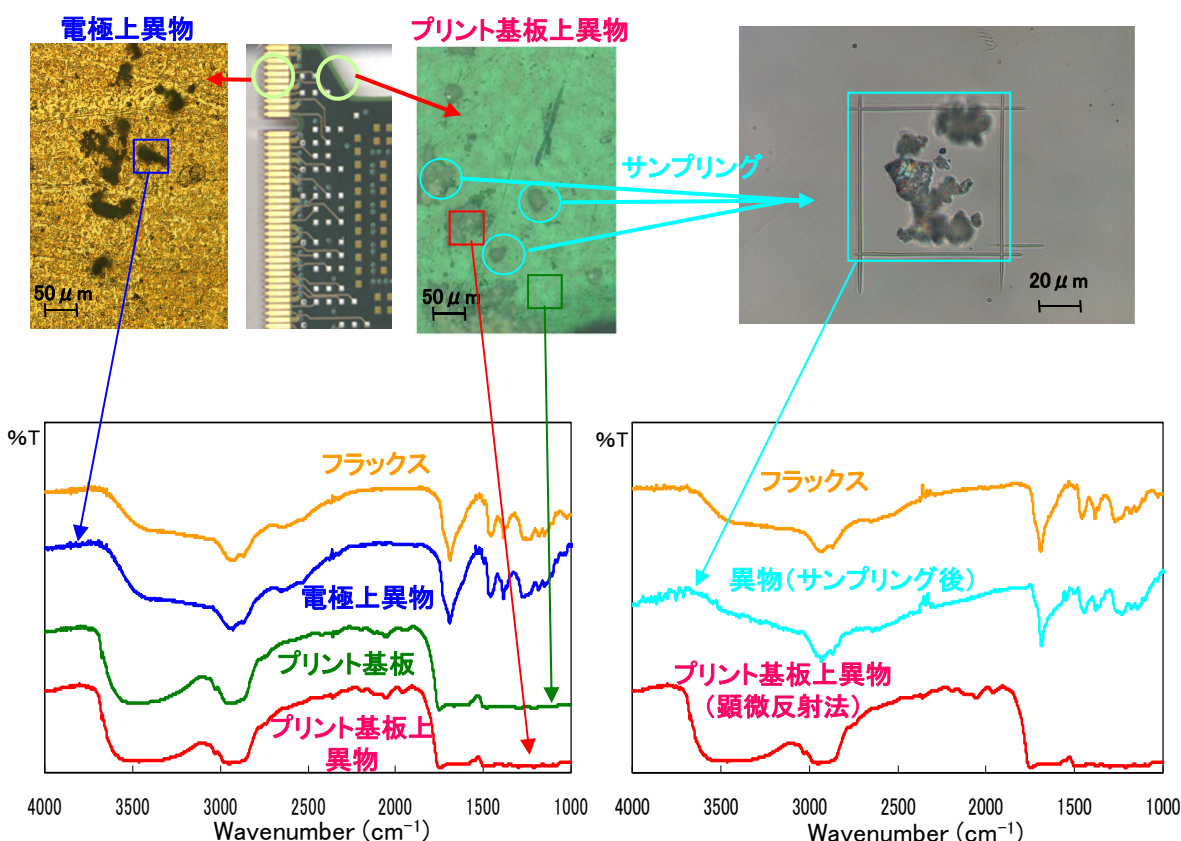


図1 FT-IRスペクトル(顕微反射法)

図2 FT-IRスペクトル(顕微透過法)

■適用例

プリント基板上、ガラス基板上異物等、下地の影響が強い場合、サンプリングを併用し、適切な測定法を選択することにより、顕微FT-IR分析による評価が可能となります。

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <https://www.mst.or.jp/>